

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60759

1983

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1991-11

Amendement 1

**Méthodes d'essais normalisés des spectromètres
d'énergie X à semicteur**

Amendment 1

**Standard test procedures for semiconductor
X-ray energy spectrometers**

© IEC 1991 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission

Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland

e-mail: inmail@iec.ch

IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Comité d'Etudes n° 45 de la CEI: Instrumentation nucléaire.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
45(BC)191	45(BC)196

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 54

7.4.1 Sources de rayonnement X

Remplacer au dernier alinéa de ce paragraphe, page 56:

«... et au paragraphe 4.1 de la Publication 340 de la CEI.» *par:*

«... et au paragraphe 6.3 de la Publication 973 de la CEI.»

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 45: Nuclear instrumentation.

The text of this amendment is based on the following documents:

Two Months' Procedure	Report on Voting
45(CO)191	45(CO)196

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Page 55

7.4.1 X-ray sources

Replace, in the last paragraph of this subclause, on page 57:

"... and Sub-clause 4.1 of IEC Publication 340." *by:*

"... and Sub-clause 6.3 of IEC Publication 973."

Page 94

Figure 15a

Remplacer la figure existante par la nouvelle figure suivante:

Replace the existing figure by the following new figure:

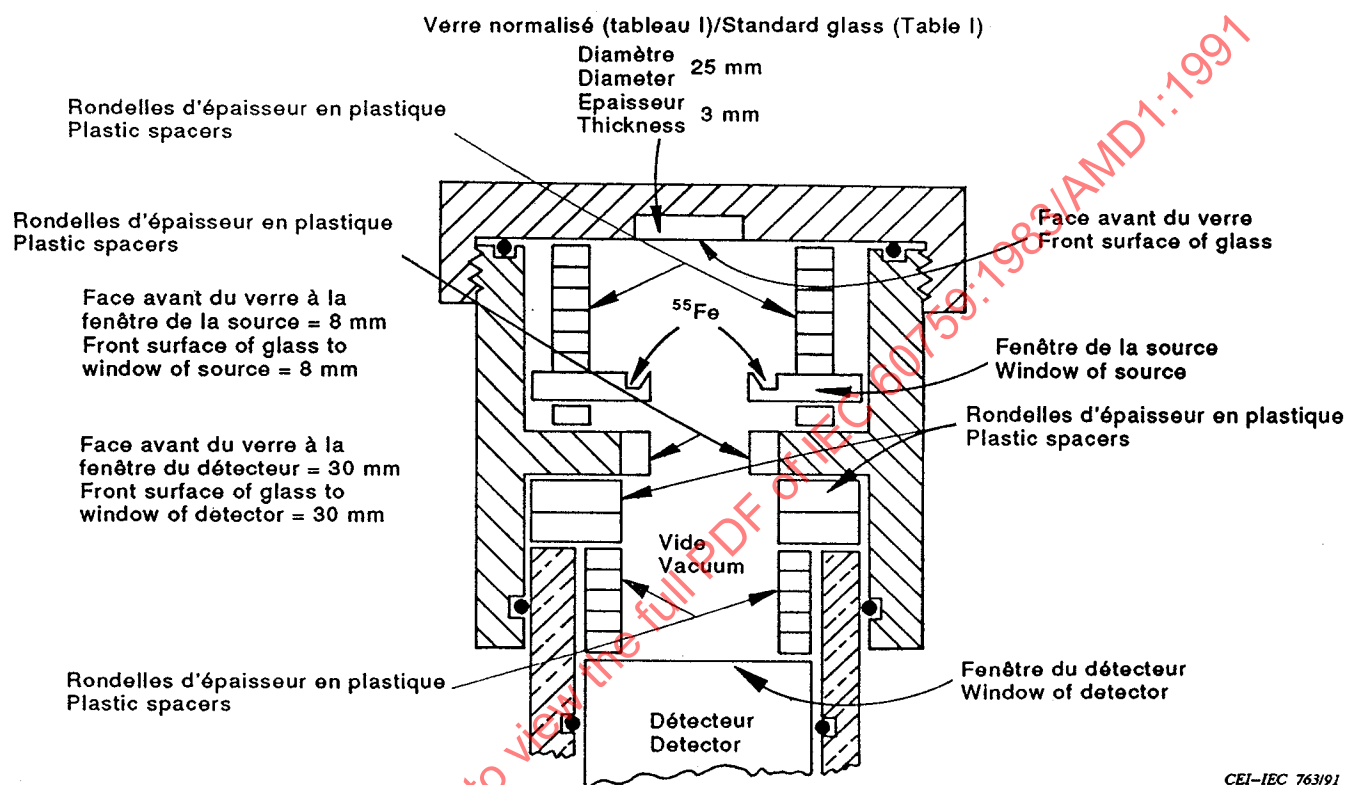


Fig. 15a. – Appareil pour la mesure des épaisseurs de fenêtre
Apparatus for window thickness measurements